

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12022-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 22.12.2023

Ausstellungsdatum: 22.12.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**TÜV Informationstechnik GmbH
Prüflabor für IT-Qualität
Am TÜV 1, 45307 Essen**

mit dem Standort

**TÜV Informationstechnik GmbH
Prüflabor für IT-Qualität
Am TÜV 1, 45307 Essen**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

- 1) Prüfungen von Produkten aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT)**
- 2) Prüfungen von Produkten aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) im Anwendungsbereich der EMVCo Security Prüfungen gemäß „EMVCo Security Evaluation Process“, V5.3, Dezember 2022**

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12022-01-00

Das Labor erbringt die Prüfung anhand folgender Prüfverfahren

1. SOP No. 1: Side-Channel Measurement
2. SOP No. 2: Network Sniffing
3. SOP No. 3: ISO 7816 Data Traffic Capturing

Basierend auf

- ISO/IEC 15408-1:2009, ISO/IEC 15408-2:2008, ISO/IEC 15408-3:2008
- ISO/IEC 18045:2008
- ISO/IEC 15408:2022
- ISO/IEC 18045:2022
- ISO/IEC TS 23532-1:2021

Die Prüfungen erfolgen bei nachfolgenden Technologien und anhand nachfolgender Assurance Families. Alle Protection Profiles, deren Anforderungen gleich hoch sind wie oder unter den hier gelisteten EAL Niveaus liegen, können bewertet werden. Etwaige Anforderungen an die Assurance Class „Life-cycle support“ (ALC) innerhalb eines Protection Profiles sind dabei nicht zu berücksichtigen.

Die Assurance Class ALC wird nicht durch das Prüflabor betrachtet, die Ergebnisse sind jedoch in die Prüfung zu integrieren.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12022-01-00

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
ACE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
ACE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
ACE_MCO	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_CCO	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
APE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9	2	-

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12022-01-00

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
	H1, H2, H3, SC, SB		
ADV_ARC	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ADV_FSP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	6	EAL7
ADV_IMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	EAL7
ADV_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	EAL7
ADV_SPM	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ADV_TDS	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	6	EAL7
ADV_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
AGD_OPE	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
AGD_PRE	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ASE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ASE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ASE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ASE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	EAL7
ASE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9	1	EAL7

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12022-01-00

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
	H1, H2, H3, SC, SB		
ASE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	EAL7
ASE_TSS	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	EAL7
ASE_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ATE_COV	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	EAL7
ATE_DPT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	4	EAL7
ATE_FUN	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	EAL7
ATE_IND	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	EAL7
ATE_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
AVA_VAN	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	5	EAL7
AVA_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12022-01-00

Verwendete Abkürzungen:

Code	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9
	Network Protocols	Communication protocols	Low-Level interfaces	Wireless	Hardware components protocols	Phone and VoIP	Mobile networks	Filtering	Intrusion detection

Code	H1	H2	H3
	Secure hardware components architectures	Hardware sensors, reactive technology	Platforms and applications security

Code	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
	Hardware architectures	Personal computer and server security	Embedded systems, microkernels	Virtualization	Applicative security	Databases	Web technologies

Code	SC	SB
	Smart Cards and similar devices	Hardware devices with security boxes

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
 EN Europäische Norm
 IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
 ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung